計測自動制御学会東北支部 第 282 回研究集会(2013.07.17) 資料番号 282-7

溶接欠陥を持つ試料から発生する 2 次高調波超音波の検出

Detection of Second Harmonic Ultrasonic Wave Generated from Specimen with Weld Defect

○杉浦 竜也*, 福田 誠*, 今野 和彦*
 ○Tatsuya Sugiura*, Makoto Fukuda*, Kazuhiko Imano*

*秋田大学 大学院工学资源学研究科

*Graduate School of Engineering and Resource Science, Akita University

キーワード:2次高調波超音波(Second Harmonic Ultrasonic Wave), Lamb 波(Lamb Wave) 溶接欠陥(Weld Defect), 接触型音響非線形性(Contact Acoustic Nonlinearity)

連絡先:〒010-8502 秋田市手形学園町 1-1 秋田大学 大学院工学資源学研究科 電気電子工学専攻 福田 誠, Tel:(018)889-2484, Fax:(018)837-0406, E-mail:mfukuda@gipc.akita-u.ac.jp

1. はじめに

溶接は建設や自動車業界などにおいて多 く使用されている.溶接部において,初期段 階の疲労き裂や応力腐食割れのような閉口 き裂が存在した場合,閉口き裂が進展し開口 き裂となり破壊や破損等につながる可能性 がある¹⁻²⁾.そのため,溶接欠陥である閉口き 裂の早期検出が望まれる.

溶接欠陥の検出には様々な検査法がある が、溶接内部に存在する欠陥の検出には超音 波探傷試験が用いられている.超音波探傷試 験では、溶接部に対して超音波を入射し、欠 陥部からの反射波を受波することにより欠 陥の有無を判断するパルスエコー法を用い る¹⁾.しかし、パルスエコー法では測定が point-to-point であるため、検査対象が配管等 の複雑な形状であると使用できない場合が 存在する.そこで、減衰が少なく、長距離伝

搬が可能な Lamb 波の利用が期待されている ³⁾. また, パルスエコー法では金属と欠陥 (空 気)との音響特性インピーダンスの差を利用 しているが、き裂幅が nm オーダの欠陥であ る閉口き裂の場合,音響特性インピーダンス の差が小さいため閉口き裂の検出は困難と なる. そこで、近年、接触型音響非線形性 (Contact Acoustic Nonlinearity: CAN)という現 象を用いた方法が注目されている⁴⁾. CANは、 弾性連続体に存在する閉口き裂にき裂幅よ りも大きい振動振幅を持つ有限振幅超音波 を入射した場合にき裂面を能動的に開閉さ せたときの非線形振動により、 高調波成分 (2f, 3f, …)もしくは分調波成分 (f/2, f/3, …) が発生する現象である⁵⁾.ここで f は入射波 の周波数を示している、非線形超音波を用い た溶接欠陥の検出に関しては、過去に分調波 を用いた溶接欠陥の検出が報告されている⁶.



2

しかし,分調波を発生させるためには,高調 波を発生させる場合に比べさらに大振幅の 音波を閉口き裂面に入射させる必要がある ため分調波の検出は容易ではない.そこで, 一度に広範囲の測定が可能である Lamb 波お よび高調波成分の中で最も検出が容易であ る2次高調波成分を用いることが,溶接欠陥 の新たな検出方法として活用できると考え られる.

本報告では、溶接欠陥である閉口き裂の早 期検出を目的として、溶接欠陥を持つ試料に Lamb 波を伝搬させ、CAN により溶接欠陥か ら発生する2次高調波成分の検出を行う.

2. 閉口き裂から発生する2次高調波成分 2-1.2次高調波成分の発生原理

CAN により閉口き裂から発生する 2 次高 調波成分の発生原理を Fig. 1 に示す. Fig. 1(a) のように,閉口き裂に対して有限振幅超音波 が入射した場合, Fig. 1(b)のように,有限振 幅超音波の圧縮相はき裂面同士を衝突させ る方向に応力が働くため,圧縮相はき裂の隙



Fig.2 解析による2次高調波成分の検出

間を閉じた後,部分的にき裂面を透過する. しかし,Fig.1(c)のように,有限振幅超音波 の引張相はき裂面を引き離す方向に応力を 与えるため,引張相はき裂面を透過せず,反 射をする.これを繰り返すことで透過波およ び反射波が半波整流されたような波形とな りひずみが生じ,2次高調波成分が発生する. 2-2.数値解析による2次高調波成分の検出

CAN の現象により,閉口き裂から発生する 2 次高調波成分の検出が可能であるかを数値 解析手法により検討する.き裂幅 10 nm の閉 口き裂に対して,中心周波数 500 kHz (基本 波)の超音波を伝搬させる.入力波形の振幅変 位を 1 nm, 10 nm および 100 nm とし,2 次高 調波成分の検出を行う.各振幅における周波 数スペクトルを Fig.2 に示す.各周波数スペ クトルは各基本波成分のスペクトルのピー ク値で正規化している.Fig.2(a)および 2(b) より,き裂幅より小さい振幅 (1 nm)および等



2

しい振幅 (10 nm)の超音波を入射した場合, 1.0 MHz (2 次高調波)の周波数スペクトルは -71 dBであり, 2 次高調波成分が検出されて いないことが確認できる.一方, Fig. 3(c)よ り,き裂幅よりも大きい振幅 (100 nm)の超音 波を入射した場合では, 2 次高調波成分の周 波数スペクトルは-40 dB であり, 2 次高調波 成分の検出量が 30 dB 以上増加している.2 次高調波成分の検出量が増加したのは, CAN の現象により閉口き裂から発生したもので あると考えられる.上記の現象を利用すれば, 2 次高調波成分の検出量の増加から閉口き裂 の検出が可能であると考えられる.本報告で は, 2 次高調波成分の検出量の増加に着目し て溶接欠陥の検出を行う.

パルスエコー法による溶接欠陥の検出 3-1. 炭素鋼平板

本報告では、材料の特性が溶接に適してい ることから多くの分野で使用されている炭 素鋼平板を試料として用いる.Fig.3に本報 告で用いる炭素鋼平板の形状と寸法を示す. 本報告で用いる炭素鋼平板は、非破壊試験用 標準試験片 (sonaspection 社, PL 18399)であ る⁷⁾.この平板は2つの母材を突き合わせ溶 接したものであり、溶接欠陥としてルート部 に対し平行に走る割れ状の欠陥であるルー トクラックが存在している.溶接欠陥は平板 の左下端をx=0mm, y=0mm とすると, y=



40mm 付近から, x 軸の負方向に 18 mm 程の 長さで存在している.閉口き裂の先端は複雑 に分岐していることから, Fig. 3 に示す位置 において溶接欠陥が存在していると考えら れる.

3-2. 測定システム

本報告で用いる炭素鋼平板中の溶接欠陥 を,従来のパルスエコー法により検出するた めに構築した測定システムを Fig. 4 に示す. 超音波パルサーからパルス波を炭素鋼平板 に入射させ,受波波形をオシロスコープに取 り込む.受波波形より,反射波の受波時間か ら溶接欠陥の検出を行う.

x軸の正方向に超音波を伝搬させ,y軸の正 方向に 10 mm ずつ探触子の位置を移動させ る実験を,x 方向反射波測定実験とする.次 に,y軸の正方向に超音波を伝搬させ,x軸の 正方向に 10 mm ずつ探触子の位置を移動さ せる実験を,y方向反射波測定実験とする.x 方向反射波測定実験では,超音波の伝搬距離 は400 mm であり,y方向反射波測定実験で は,超音波の伝搬距離は200 mm である.伝 搬距離と炭素鋼平板の縦波音速より,炭素鋼 平板の端からの反射波受波時間を算出する と,x方向反射波測定実験では34 µs である.

3-3. 測定結果

x 方向反射波測定実験の結果の一例として、
 溶接欠陥が存在していると考えられる、y =
 20 mmの測定点における受波波形を Fig. 5(a)
 に示す.また、溶接欠陥が存在していないと
 考えられる、y=60 mmの測定点における受



Fig.5 x 方向反射波測定実験の結果の一例



波波形を Fig. 5(b)に示す. Fig. 5 より, 超音波 入射後, 1 つ目の反射波は溶接欠陥の有無に 限らず, 68 μs であることがわかる.



次に, x 方向反射波測定実験における,各 測定点の1つ目の反射波が受波された時間を 比較した結果を Fig. 6(a)に示し, y 方向反射波 測定実験における,各測定点の1つ目の反射 波が受波された時間を比較した結果を Fig. 6(b)に示す. Fig. 6 より,すべての測定点で, 炭素鋼平板の端からの反射波が受波される 時間において,反射波が検出されていること がわかる.これより,炭素鋼平板中の溶接欠 陥は,従来のパルスエコー法では検出できな い閉口き裂であると考えられる.

4. Lamb 波の発生原理および駆動周波数

本報告では、減衰が少なく長距離伝搬が可 能であることから、有限振幅超音波として Lamb 波を用いる. Lamb 波は平板材料中にお いてモード変換を繰り返すため、伝搬挙動が 複雑となる. 複雑な Lamb 波の伝搬挙動は、 Rayleigh-Lamb 方程式に平板中の縦波音速 c_{L} および横波音速 c_{T} を代入することにより求 めることができる. Fig. 7 に本報告で用いる



Fig.8 測定システム

炭素鋼平板 (*c*_L = 5700 m/s, *c*_T = 3200 m/s)の速 度分散曲線を示す. Fig. 7 では 3 次以上の伝 搬モードは省略している. また, Fig. 7 は炭 素鋼平板の厚さ *d* = 10 mm で正規化を行って いる.

Lamb 波を用いて 2 次高調波成分の検出を 行う場合,送波した周波数の 2 倍の周波数に. 送波したモードと同一速度を有する高次の モードが存在することが望ましい⁸⁾. Fig. 7 より,本報告では送波に 235 kHz の S0 モー ドを,受波は 2 倍の周波数である 470 kHz の A1 モードを利用する.

5. 溶接欠陥から発生する 2 次高調波の検出 5-1. 測定システム

本報告では、溶接欠陥として存在する閉口 き裂から発生する2次高調波成分の検出を行 う.一般に、2次高調波成分の周波数スペク トルは基本波成分の周波数スペクトルより も小さい、2次高調波成分を効率良く検出す るために、本報告ではアベレージング機能に より、リアルタイムで基本波成分を低減させ 2 次高調波成分を強調する Pulse Inversion Averaging (PIA)法を用いる⁹.

本報告で用いる,透過法により閉口き裂か ら発生する2次高調波成分を検出するために 構築した測定システムをFig.8に示す.送波 用斜角探触子から235 kHzのLamb波を炭素 鋼平板に伝搬させるために,発振器1より駆 動周波数235 kHzのバースト正弦波8波を発



振し、バイポーラ増幅器によって 140 V_{pp} ま で増幅させ、送波用斜角探触子に印加する. その後、平板中を伝搬した Lamb 波を受波用 斜角探触子で受波し、直流成分を除去するた めに High Pass Filter (カットオフ周波数 $f_c = 1$ kHz)を通過させ、Vector Signal Analyzer に取 り込み、周波数スペクトルを観測する.発振 器 2 では、PIA を行うために発振周期を変え て、正位相と逆位相の信号を交互に送波する. 5-2. 測定方法

本報告の測定方法を Fig. 9 に示す. Fig. 9(a) のように, x 軸方向に Lamb 波を伝搬させ, y 軸の正方向に 20 mm ずつ探触子を移動させ る測定を x 方向 2 次高調波検出実験とする. 次に, Fig. 9(b)のように, y 軸方向に Lamb 波 を伝搬させ, x 軸の正方向に 20 mm ずつ探触 子を移動させる測定を y 方向 2 次高調波検出 実験とする.各測定回数は 5 回とする.また, 送波用斜角探触子と受波用斜角探触子の位 置を取り換え, Lamb 波の伝搬方向を変え同 様に 2 次高調波成分の検出実験を行う.

なお, x 方向 2 次高調波検出実験での Lamb 波の伝搬距離 *l* = 185 mm とし, y 方向 2 次高



調波検出実験での Lamb 波の伝搬距離 l = 85 mm とする.

5-3. x 方向 2 次高調波検出実験

x 方向 2 次高調波検出実験における, x 軸正 方向に Lamb 波を伝搬させた際の結果の一例 として, 閉口き裂が存在していると考えられ る, y = 20 mmの測定点における PIA 法適用 前の受波波形を Fig. 10(a)に示す. 閉口き裂が 存在していないと考えられる, y = 80 mmの 測定点における PIA 法適用前の受波波形を Fig. 10(b)に示す. Lamb 波を用いた従来の斜 角探傷法では,透過波の受波波形より欠陥の 検出を行う. しかし, Fig. 10(a)および 10(b) の受波波形である時間波形からでは, 閉口き 裂の有無は確認できないことがわかる. これ より, 炭素鋼平板中の閉口き裂は, 従来の斜 角探傷法では検出が困難であると考えられ る.

y = 20 mmの測定点における PIA 法適用後の周波数スペクトルを Fig. 10(c)に示す. y =
 80 mmの測定点における PIA 法適用後の周波

数スペクトルを Fig. 10(d)に示す. Fig. 10(c) および 10(d)より, 閉口き裂が存在している と考えられる測定点において, 2 次高調波成 分の検出量が 8 dB 増加している.これより, 2 次高調波成分の検出量に着目することで閉 口き裂の検出が可能であると考えられる.

次に, 探触子を 20 mm 間隔で移動させた際 の各測定点における 2 次高調波成分の検出量 を比較した結果を Fig. 11 に示す. Fig. 11(a) は Lamb 波を x 軸の正方向に伝搬させた際の 結果を示しており, Fig. 11(b)は Lamb 波を x 軸の負方向に伝搬させた際の結果を示して いる. Fig. 11 のプロットは 5 回の測定におけ る平均値を表しており, エラーバーはばらつ きを示している. なお, 各周波数スペクトル は, PIA 法適用前の基本波成分のスペクトル のピーク値で正規化を行っている.

Fig. 11 より, Lamb 波の伝搬方向によらず,
 閉口き裂が存在していると考えられる y = 20
 mmの測定点で他の測定点に比べて 2 次高調
 波成分の検出量が約 7 dB 増加していること



Fig. 12 y方向 2 次高調波検出実験の結果

がわかる. これは閉口き裂において CAN に より2次高調波成分の検出量が増加したため であると考えられる. これより y = 20 mm 付 近に閉口き裂が存在していると推定できる.

5-4. y方向2次高調波検出実験

探触子を 20 mm 間隔で移動させた際の各 測定点における 2 次高調波成分の検出量を比 較した結果を Fig. 12 に示す. Fig. 12(a)は Lamb 波を y 軸の正方向に伝搬させた際の結 果を示しており, Fig. 12(b)は Lamb 波を y 軸 の負方向に伝搬させた際の結果を示してい る. Fig. 12 のプロットは 5 回の測定における 平均値を表しており, エラーバーはばらつき を示している. なお, 各周波数スペクトルは, PIA 法適用前の基本波成分のスペクトルのピ ーク値で正規化を行っている.

Fig. 12 より, Lamb 波の伝搬方向によらず, 閉口き裂が存在していると考えられる x = 60 mm~80 mmの測定点で他の測定点に比べて 2 次高調波成分の検出量が約4 dB 増加してい る. これは閉口き裂において CAN により 2 次高調波成分の検出量が増加したためであ ると考えられる. これより x = 60 mm~80 mm に閉口き裂が存在していると推定できる. 5-5. 考察

本報告では,透過法により閉口き裂から発 生する 2 次高調波成分の検出を行った. Fig. 11 および Fig. 12 より, Lamb 波の伝搬方向に 限らず、閉口き裂が存在していると考えられ る x = 60 mm ~ x = 80 mm, y = 20 mm の範囲 において,他の測定点と比較して2次高調波 成分の検出量が増加していることが確認で きた.2次高調波成分の検出量の増加は閉口 き裂から発生したものであると考えること ができ, $x = 60 \text{ mm} \sim x = 80 \text{ mm}$, $y = 20 \text{ mm} \mathcal{O}$ 範囲に閉口き裂が存在していると考えるこ とができる.これは、溶接欠陥が存在してい ると考えられる範囲とほぼ一致することか ら,本手法を用いて,溶接欠陥として存在す る閉口き裂の検出への可能性を示すことが できた.

6. おわりに

本報告では、溶接欠陥を持つ炭素鋼平板中 に Lamb 波を伝搬させ、2 次高調波成分を用 いて溶接欠陥の検出を行った.その結果、閉 ロき裂が存在していると考えられる x = 60mm~x = 80 mm, y = 20 mmの測定範囲にお いて、他の測定範囲に比べて2 次高調波成分 の検出量の増加を確認できた.また、溶接欠 陥が存在していると考えられる範囲とほぼ 一致することも確認できた.これより、本手 法を用いて、従来の超音波探傷試験では検出 できない溶接欠陥の検出への可能性を示す ことができた.

今後の課題として,溶接欠陥から発生した 2 次高調波がどのように平板中を伝搬してい るのかを把握するために,溶接欠陥を伝搬す る Lamb 波の伝搬解析を行うことなどが挙げ られる.

≪参考文献≫

- 溶接学会: "溶接技術の基礎", 精興社, pp. 194-219 (2005)
- 杉本幸郎:日本音響学会誌,61 巻,11
 号,pp. 671-676 (2005)

- J. P. Sargent : Insight, Vol. 48, No. 3, pp. 160-167 (2006)
- 4) I. Yu. Solodov : Proc. 1994 IEEE
 ULTRASONICS SYMPOSIUM , pp. 1279-1238 (1994)
- 5) K. Kawashima, R. Omote, T. Ito and H. Fujita : Ultrasonics, Vol. 48, pp. 611-615 (2002)
- S. Horinouchi, M. Ikeuchi, Y. Shintaku, Y. Ohara, and K. Yamanaka: Jpn. J. Appl. Phys, Vol. 51, pp. 07GB15-1-5 (2012)
- http://www.sonaspection.com/SonaCatalog. pdf
- C. Pruell, J. -Y. Kim, J. Qu, L. J. Jacobs : NDT&E International, Vol. 42, pp. 199-203 (2009)
- M.Fukuda, M.Nishihira and K.Imano: Jpn.
 J. Appl. Phys, Vol.45, No.5B, pp.4556-4559 (2006)